

Pressemitteilung, Juni 2010

Zeitgewinn durch doppelseitiges AOI

Automatische Testsysteme dienen nicht nur der Sicherung und Verbesserung der Fertigungsqualität - im Vergleich zu manuellen Prüfungen stehen sie vor allem für Zeitersparnis und damit verbundene Kostenvorteile. Gerade bei **doppelseitig bestückten Baugruppen** können durch eine parallele Inspektion der Baugruppenober- und Unterseite die Prüf- und Handlingszeiten nochmals signifikant gesenkt werden. Vor diesem Hintergrund hat Schneider & Koch sein neues AOI-System **LaserVision Compact^{TWIN}** entwickelt. Durch die Integration eines zweiten Testkopfes in das bewährte LaserVision System, können doppelseitig bestückte Baugruppen zeitgleich von oben und unten geprüft werden. Die zeitintensive Wendung und zweimalige Prüfung ein und derselben Baugruppen entfällt somit. Das **LaserVision Compact^{TWIN}** erfüllt alle typischen Inspektionsaufgaben wie Lötstellenkontrolle, Kurzschluss tests, Schriften- und Barcodeerkennung, Prüfung von Bestückungswinkeln sowie Prüfung von Anwesenheit, Lage und Polarität von THT- und SMD-Bauteilen. Farbkameras mit Megapixel-Technologie und telezentrischem Objektiv gestatten Aufnahmen in diversen Auflösungen. Es können Bauteile mit einer beidseitigen Bestückhöhe von bis zu 45mm inspiziert werden. Das **LaserVision Compact^{TWIN}** ist modular aufgebaut und kann je nach Anforderung als einseitiges oder doppelseitiges AOI-System genutzt werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, 3-D-Prüfungen durch die Integration eines zusätzlichen Schrägblick-Moduls durchzuführen. Die ausgereifte Systemsoftware zeichnet sich vor allem durch die außerordentlich einfache und schnelle Prüfprogrammerstellung sowie durch die übersichtliche Darstellung der Prüfergebnisse aus.

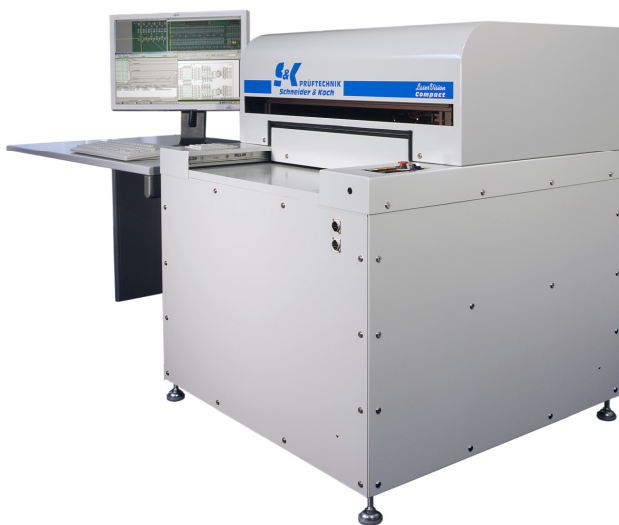


Abb.: LaserVision Compact^{TWIN},
Schneider & Koch